

ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERIZATION OF CHEMICALLY
DEPOSITED SEMICONDUCTING FILMS

تم تحضير أغشية كبريتات الكاديوم باستخدام تقنية "الترسيب بواسطة الحمام الكيميائي". كما تم استخدام نوعين من الخلفيات: شرائح زجاجية عادية و شرائح زجاجية مغطاة بطبقة موصلة كهربياً من مادة ITO. سمك العينات تراوح من ٥٠,٨ إلى ٣٦٠ نانومتر. الأغشية المرسبة على الزجاج العادي تم استخدامها في القياسات الضوئية وذلك بدراسة امتصاصية ونفاذية هذه الأغشية للضوء المرئي كدالة في طاقة الفوتونات. بناءً على هذه النتائج تم حساب فجوة الطاقة ومعامل الامتصاص وعمق الإخماد. سمك العينات المستخدمة في القياسات الضوئية حُدد بطريقة القياس الوزني. وُجد في هذه الدراسة أن فجوة الطاقة تتراوح بين ٢,٤٢ و ٢,٤٥ إلكترون فولت وهذه القيمة قريبة جداً من القيم المحسوبة في العديد من الدراسات الأخرى. الأغشية المرسبة على الزجاج المغطى بطبقة ITO استخدمت في دراسة ميكانيكية حركة الإلكترونات داخل الأغشية وذلك عن طريق دراسة منحنيات التيار-الجهد للعينات عند درجات حرارة مختلفة. أمكن الحصول على هذه المنحنيات بعد ترسيب دوائر من الألمنيوم على أغشية كبريتات الكاديوم. سمك هذه الأغشية حُددت بطريقة المكثفات الكهربائية. وُجد أن التيار الكهربائي يخضع لنظرية "التيار المحدود بالشحنة الفراغية" بحيث أن المصائد تتوزع توزيعاً منتظماً في فجوة الطاقة ، وعليه تم حساب كثافة المصائد التي قدرت ب ٣,٢٥ × ١٩١٠ سم^{-٣} إلكترون فولت-١.

: أ.د. أظهر أنصاري ، د. سعيد بابكير

: ٢٠٠٦